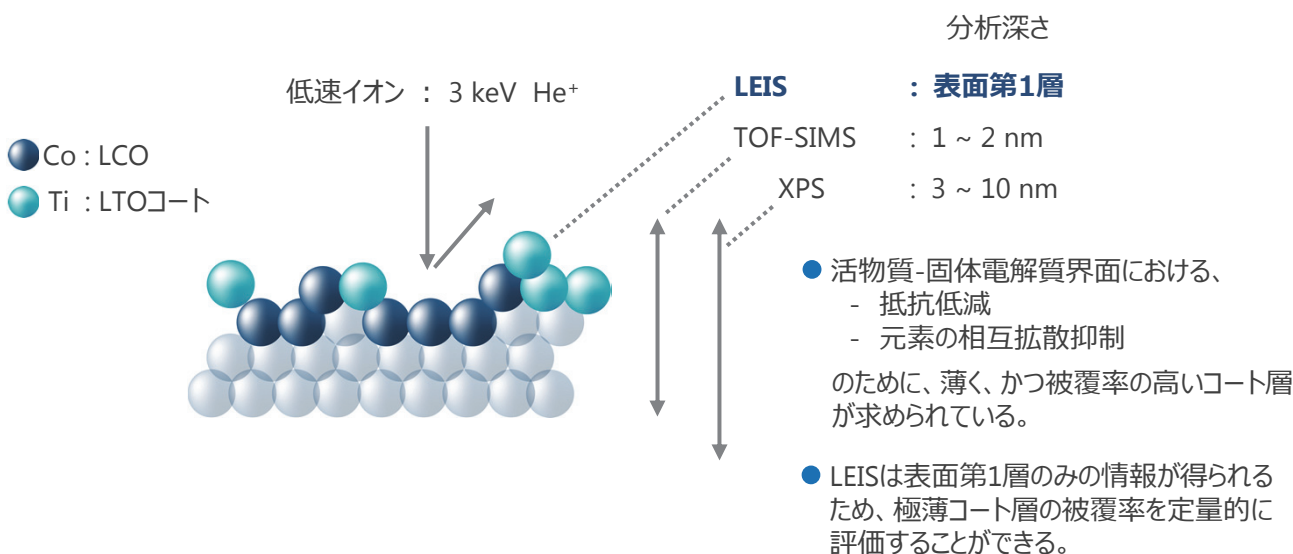


LEISによる活物質表面コート層の被覆率評価

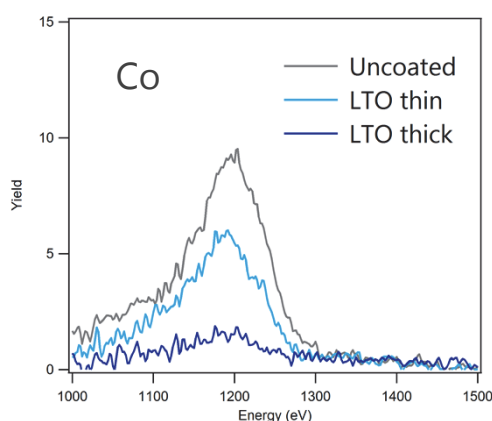
LEISは表面第1層のみの元素情報が得られる、唯一の表面分析手法である。コート層の膜厚が非常に薄い場合でも、下地の影響を除いた、定量的な被覆率評価が可能となる。ここでは、LCO粉末上のLTOコート層の被覆率を評価した。

LEIS – Low Energy Ion Scattering

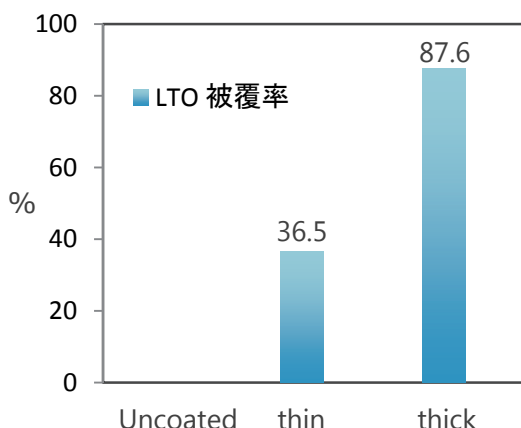


LTOコート層の被覆率評価

- LTOコート LCO粉末, LTO膜厚 : thin, thick



LEISスペクトルの比較



- 表面第1層のみの情報 : 下地の情報を含まない被覆率評価
- ビーム径 1 mmφ : 粉末の平均情報が定量的に得られる

活物質上コート層の完全性が、定量的に評価できる